

Wir sehen mehr!

Rasterelektronenmikroskopie Mikrobereichsanalyse

Unser Labor für Rasterelektronenmikroskopie & Mikrobereichsanalyse ist ausgestattet mit:

- 2 Rasterelektronenmikroskopen (REM) vom Typ VEGA Fa. TESCAN
- zwei peltierelementgekühlten SDD-EDX-Detektor (x-Flash) für die Mikrobereichsanalyse (EDX) der Firma Bruker
- einem Kohlefadenbedampfungsgerät
- einem Sputter zur Beschichtung von Oberflächen mit Gold

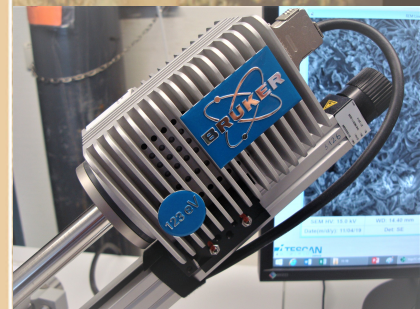
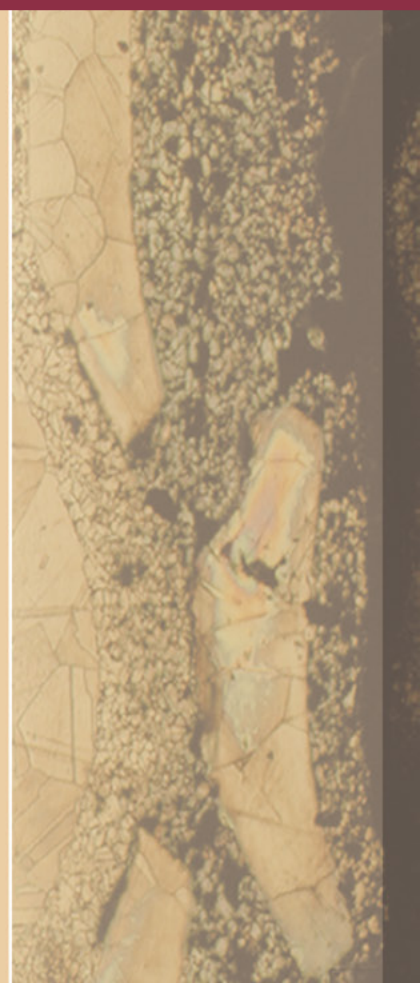
Die Kammerausstattung der Mikroskope erlaubt uns:

- eine Probengröße von max: 150 mm x 150 mm x 60 mm (LxBxH) zu untersuchen
- die bildliche Darstellung von Oberflächen im Sekundärelektronen- und im Rückstreuелеktronenmodus
- die Untersuchung von nichtmetallischen Proben im Niedrigvakuummodus

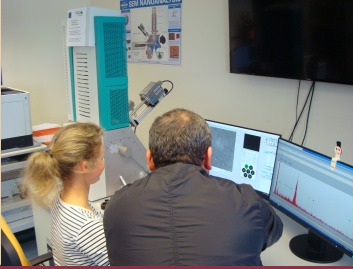
Mit der Mikrobereichsanalyse kann:

- die chemische Zusammensetzung im Punkt- und Flächenmodus bestimmt werden
- ein Konzentrationsprofil (Line-Scan) aufgenommen oder ein Elementverteilungsbild (Mapping) dargestellt werden

Wir untersuchen für Sie Bruchflächen, Schliffflächen sowie andere Oberflächen, Schichtaufbauten u.a.m.

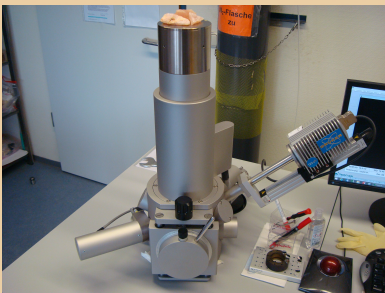


leistungsstarker X-Flash - Detektor



Verfahren

Im Akkreditierungsumfang unseres Labors:



Kleinkammer - REM

DIN ISO 22309

Mikrobereichsanalyse- quantitative Analyse mittels EDS für Elemente mit einer Ordnungszahl > 11 (No.) oder höher

ASTM E 1508 a-2012

Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy.

VDI-RL 3866 Bl.5

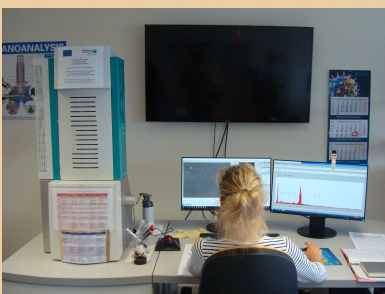
Bestimmung von Asbest in technischen Produkten,
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren.

DGUV213-546 (Zuvor: BGI 505-46)

Verfahren zur getrennten Bestimmung von lungen- gängigen Asbestfasern und anderen anorganischen Fasern, Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren.

VDI-RL 3492

Messen von Innenraumlufverunreinigungen, Messen von Immissionen, Messen anorganischer faserförmiger Partikel, Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren.



Großkammer - REM